

昆山市粉体粒径测试范围 粉末激光粒径检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆山市粉体粒径测试范围 粉末激光粒径检测 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

粉体学-粒径的测定方法介绍(包括筛分法等)1、显微镜法本法主要测定几何学粒径。光学显微镜可以测定微米级的粒径，电子显微镜可以测定纳米级的粒径。本法方便、可靠，能用于测定散剂、混悬剂、剂、混悬型软育剂等粉体粒径,可测粒径范围为0.2 ~100um.

2、筛分法其是粒径与粒径分布测量中使用zui早、应用zui广，且简单快速的方法。即利用筛孔将粉体机械阻挡的一种分级方法。将筛子由粗到细按筛号顺序上下排列，将一定量的粉体样品置于zui上层，振动一定时间，称量各个筛号上的粉体重量，求得各筛号上的不同孔径重量百分数，由此获得以重量为基准的筛分粒径分布及平均粒径。3、库尔特计数法 本法测得的粒径为等体积球相当径，可以求得以个数为基准的粒度分布或以体积为基准的粒度分布，通常可用于测定粉末.混悬液、剂、质体等制剂，也可用于注射剂的不溶性微粒检查。4、沉降法是通过监测混悬液粒子的沉降速度，利用粒子在液体介质中的沉降

速度与粒子大小的关系，即Stokes定律,测定粒子有效径的方法。5、比表面积法利用粉体的比表面积随粒径的减少而迅速增加的原理，通过粉体层中比表面积的信息与粒径的关系求得平均粒径的方法。